



NEWS RELEASE

報道資料
2009年7月17日
(日本時間)

アプライド マテリアルズの SEMVision G4 が セミコンダクター インターナショナル誌のベストプロダクト賞を受賞

アプライド マテリアルズ (Applied Materials, Inc., Nasdaq : AMAT、本社 : 米国カリフォルニア州サンタクララ、会長兼 CEO マイケル・スプリンター) は7月15日 (現地時間)、欠陥レビュー装置 Applied SEMVision™ G4 Defect Analysis がセミコンダクター インターナショナル (SI) 誌のエディターズチョイス ベストプロダクト賞を受賞したことを発表しました。32nm デザインルール以降に対応した欠陥レビュー装置としての革新的な技術と実証済みの性能が評価されたものです。

SI 誌の編集長ローラ・ピーターズ氏は次のように語っています。「エディターズチョイス ベストプロダクト賞は、製造現場で優秀さが実証された製品、材料、サービスを表彰するプログラムです。製品の審査は現場ユーザーからのフィードバックを基に本誌のエディターが行い、毎年、高い評価を得た製品のみを選出しています」

アプライド マテリアルズのシニアバイスプレジデント兼ジェネラルマネージャー (シリコンシステムズグループ)、トム・セントデニスは次のように述べています。「今回の受賞は、アプライド マテリアルズの SEMVision の技術が半導体業界に及ぼした多大な影響が評価された結果と考えています。SEMVision G4 の並はずれた高画質と先進的な材料分析機能は、欠陥の根本原因を把握し歩留まりの向上に貢献するツールとして、半導体メーカーを強力に支援しています」

Applied Defect Review SEMVision は、最先端のレビュー用に設計されたもので、自動欠陥再検知 (ADR) および自動欠陥分類 (ADC) 機能を備えています。SEMVision G4 の主な特長としては、新しい走査電子顕微鏡 (SEM) カラム技術の採用、強化された複合視野画像処理技術 MPSI (Multi-Perspective SEM Imaging) 機能による物理解像度 2nm の高画質、毎秒1欠陥という高水準のレビュー速度などが挙げられます。

Applied SEMVision は、1998年に自動欠陥レビュー装置のパイオニアとして発表され、ファブ内での欠陥検出と欠陥情報の分析に革命をもたらしました。過去10年間に世界中で700台以上の SEMVision がお客様に納入され、業界を支えてきました。アプライド マテリアル

ズの SEMVision シリーズが SI 誌から同賞を授与されるのは、2000 年の SEMVision、2005 年の SEMVision G2 FIB に次いで今回が 3 回目です。

アプライド マテリアルズは、半導体チップ、フラットパネル、太陽電池、フレキシブルエレクトロニクス、省エネガラスの製造におけるイノベーターな装置、サービスおよびソフトウェア製品を幅広く提供する Nanomanufacturing Technology™ ソリューションのグローバルリーダーです。アプライド マテリアルズは、人々のライフスタイルを向上させるナノマニュファクチャリングテクノロジーを提供します。

詳しい情報はホームページ：<http://www.appliedmaterials.com> でもご覧いただけます。

このリリースは7月15日米国においてアプライド マテリアルズが行った英文プレスリリースをアプライド マテリアルズ ジャパン株式会社が翻訳の上、発表するものです。

アプライド マテリアルズ ジャパン株式会社（本社：東京都、代表取締役社長：渡辺徹）は1979年10月に設立。大阪支店ほか12のサービスセンターを置き、日本の顧客へのサポート体制を整えています。

このリリースに関する詳しいお問い合わせは下記へ

アプライド マテリアルズ ジャパン株式会社
〒108-8444 港区海岸 3-20-20 ヨコソーレインボータワー
社長室：大橋 百合（Tel: 03-6812-6801 / Fax: 03-6812-6831）
ホームページ：<http://www.appliedmaterials.com>
